



УНИВЕРЗИТЕТ
У НОВОМ САДУ



ФАКУЛТЕТ
ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 6350-413; 021 450-810; Централа: 021 485 2000
Рачуноводство: 021 458-220; Студентска служба: 021 6350-763
Телефакс: 021 458-133; e-mail: ftndean@uns.ns.ac.yu



Сертификован
систем
квалитета



81. Sastanak IEEE u Novom Sadu / 81th IEEE Meeting in Novi Sad
Obaveštavamo sve zainteresovane / Announcement

Prof. dr Svetlana Avramov-Zamurović

IEEE Member
United States Naval Academy
ANNAPOULIS, USA

<http://www.usna.edu/Users/weapsys/avramov>

u **utorak, 07. 04. 2009.** u Svečanoj Sali
Fakulteta tehničkih nauka u Novom
Sadu, sa početkom u **11:00 h**, održaće

On **Tuesday, April 7, 2009**, in Ceremonial
Hall of Faculty of Technical Sciences, at
11:00 am will deliver

P R E D A V A N J E L E C T U R E

METODA SAŽETOG PRONALAŽENJA INFORMACIJA

Compressive sensing

Abstract: Metoda Sažetog pronalaženja informacija predstavlja sasvim novi način prikupljanja uzorka koji se fokusira samo na ono što je korisniku značajno. Oblast je nastala pre nekoliko godina i mnogi naučnici, kako matematičari, tako i inženjeri i fizičari, vide značajne mogućnosti u raznovrsnim primenama. Predavanje će predstaviti matematički aparat i prikazati eksperimente koji uspešno koriste tu metodu sa osvrtom na njene prednosti i ograničenja. U okviru matematičkog aparat-a predlaže se uzimanje izabranih odmeraka, onih koji nose informaciju. Metoda je bazirana na činjenici da se originalna informacija može predstaviti sa svega nekoliko značajnih komponenti i da se u procesu uzimanja podataka mere linearne kombinacije originalnih odbiraka koje moraju da sačuvaju strukturu informacije. Ova kompresija je bez gubitaka i značajno smanjuje broj uzoraka u odnosu na onaj koji zahteva Nyquistov kriterijum odabiranja.

Suorganizatori: Katedra za električna merenje i



Networking
the World™

IEEE – Serbia & Montenegro Section

**Joint Chapter – Power Electronics,
Industrial Electronics &
Industry Applications Society**

NOVI SAD
www.ftn.ns.ac.yu/ieee

